First Hit

Generate Collection

L12: Entry 1 of 1

File: JPAB

Feb 2, 1999

PUB-NO: <u>JP411031921A</u>

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 11031921 A TITLE: VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR

PUBN-DATE: February 2, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TSUZUMI, SHUJI HANASHIMA, NAOYUKI YONEZAWA, MASA HIKITA, KAZUYASU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

MITSUBISHI MATERIALS CORP

APPL-NO: JP09188024

APPL-DATE: July 14, 1997

INT-CL (IPC): $\underline{\text{H03}}$ $\underline{\text{B}}$ $\underline{\text{5}}/\underline{\text{30}}$

ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To vary the VHF through SHF bands in a wide range and also to secure the high stability for a voltage controlled oscillator by forming a lead zilconate titanate(PZT) thin film or a piezoelectric thin film of lead titanate(PT) on a monocrystal substrate and using a piezoelectric resonator obtained by forming a conductive film on the piezoelectric thin film.

SOLUTION: A voltage controlled oscillator uses a 1-port or 2-port type surface acoustic wave resonator having a comb-line electrode consisting of a piezoelectric thin film formed on a monocrystal substrate and a conductive film formed on the piezoelectric thin film. The piezoelectric thin film consists of a PZT thin film or PT. For instance, a buffer layer(BST thin film) 52 of 0.2 μm thickness, a PZT thin film 53 of 0.8 μm thickness and Al electrodes 54 of 1500 Å thickness are formed on a sapphire(monocrystal) substrate 51 of 500 μm thickness to obtain a piezoelectric substrate 50. Then a gap W is set at 2 μm (1/2 surface acoustic wave length λ) between Al electrodes 54 (a repeller 54A, a comb-line electrode 54B).

COPYRIGHT: (C) 1999, JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-31921

(43)公開日 平成11年(1999)2月2日

(51) Int.Cl.⁶

H 0 3 B 5/30

識別記号

H 0 3 B 5/30

Α

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)

(21)出願番号

特願平9-188024

(22)出顧日

平成9年(1997)7月14日

(71)出願人 000006264

三菱マテリアル株式会社

東京都千代田区大手町1丁目5番1号

(72)発明者 津々見 修可

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

(72)発明者 花嶋 直之

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

(72)発明者 米澤 政

埼玉県大宮市北袋町1丁目297番地 三菱

マテリアル株式会社総合研究所内

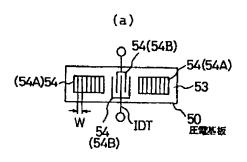
最終頁に続く

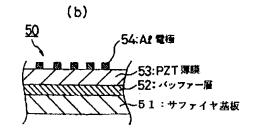
(54) 【発明の名称】 電圧制御発振器

(57)【要約】

【課題】 VHF~SHF帯域に対応し、広帯域可変、 高安定の電圧制御発振器を提供する。

【解決手段】 単結晶基板と、該単結晶基板上に構成さ れた圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上に構成された導電性 膜とからなる櫛形電極を設けてなる1ポートまたは2ポ ート型弾性表面波共振子を用いた電圧制御発振器におい て、上記圧電体薄膜は、チタン酸ジルコン酸鉛 (PZ T) 薄膜又はチタン酸鉛 (PT) からなる電圧制御発振 昭.





【特許請求の範囲】

【請求項1】 単結晶基板と、該単結晶基板上に形成さ れた圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電性 膜とを備える圧電共振子を用いた電圧制御発振器におい て、上記圧電体薄膜がチタン酸ジルコン酸鉛薄膜又はチ タン酸鉛薄膜であることを特徴とする電圧制御発振器。 【請求項2】 上記圧電共振子が、単結晶基板と、該単 結晶基板上に形成された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上 に形成された導電性膜よりなる櫛形電極とを備える弾性 表面波共振子であることを特徴とする請求項1記載の電 10 圧制御発振器。

【請求項3】 上記圧電共振子が、単結晶基板と、該単 結晶基板上に形成された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上 に形成された導電性膜よりなる櫛形電極とを備える 1 ポ ート型弾性表面波共振子であることを特徴とする請求項 1記載の電圧制御発振器。

【請求項4】 上記圧電共振子が、単結晶基板と、該単 結晶基板上に形成された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上 に形成された導電性膜よりなる櫛形電極とを備える 2ポ 1記載の電圧制御発振器。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、圧電共振子を用い た電圧制御発振器に係り、特に、圧電共振子の圧電体薄 膜としてチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)又はチタン酸 鉛(PbTiO3:PT)を成膜した電圧制御発振器に 関する。

[0002]

 $\triangle f/f_0 = -(1/2) \cdot (1/r) \cdot (C_0 \cdot C_L / (C_0 + C_L)^2) \cdot (\triangle C/C_L) \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$

ただし、rは共振子の容量比C₀/C₁, △Cはパラクタ の容量変化量である。

【0006】ここで、広い周波数帯域に亘り発振周波数 f ® を可変するには、共振-反共振周波数の幅の広い共 振子、即ち、容量比ァの小さい共振子と容量変化の大き いパラクタを使途しなければならない。

【0007】ところが、従来の発振器では、図3に示す 如く、共振子と直列にパラクタの容量Ci及び回路の負 荷容量CLが入るため、共振周波数が上昇し共振子の見 かけ上の容量比が大きくなることから、図4のようにイ 40 ンダクタンスし。(伸張し)を共振子1に直列に挿入し た回路4とし、直列容量によって共振周波数を低下さ せ、共振子の誘導性領域を広くして使用している。

【0008】しかしながら、この場合でもパラクタの容 量変化量が有限でしかも小さいために、広帯域可変のも のを実現することは困難であった。

【0009】特開昭61-135205号公報には、上 記問題を解決するために、負性抵抗を伴ったインダクテ ィブトランジスタ回路を発振回路として使用し、これに より、共振子の容量比を劣化することなく周波数可変幅※50

2 *【従来の技術】圧電性基板を使用した共振子には、水晶 振動子や弾性表面波共振子及び圧電薄膜共振子等がある が、このような圧電共振子は電気的等価回路で表すと、 いずれも図1のように表すことができる。図1におい て、Coは電極間の静電容量と端子間の浮遊容量を加算 したものであり、インダクタンスL』、キャパシタンス C1 、及び抵抗R1 の直列共振回路は共振子の共振現象 を表している。

【0003】図2は、上記共振子を用いて従来最も多く 使用されているコルピッツ型の電圧制御発振器を示す基 本構成図である。図2において、1は共振子、3は破線 より右側の発振用トランジスタTrを含む回路、C i は、パラクタ(可変容量ダイオード)2の容量、C11 ~C13はそれぞれキャパシタンス、R11~R14はそれぞ れ抵抗を示している。この発振器の等価回路は、共振子 1の側と、それ以外の回路3とに区別して考えれば、図 3のように表すことができる。 このようなコルピッツ型 発振器においては、共振子1を共振-反共振の間の周波 数で使用し、誘電性リアクタンス即ちインダクタンスし ート型弾性表面波共振子であることを特徴とする請求項 20 として働かせている。この場合、回路3側のリアクタン スは容量性となり、キャパシタンス (負荷容量) C_L で 表すことができ、発振周波数はおおむねインダクタンス Lとパラクタ $C_{\mathfrak{j}}$ または負荷容量 $C_{\mathfrak{l}}$ とパラクタ $C_{\mathfrak{j}}$ との 直列共振周波数となる。

> 【0004】そこで、共振子1に直列に接続したパラク タ2に印加される逆バイアス電圧 (制御電圧) Vr を変 えることにより、Cj がVr-x に比例し発振周波数fo を下記式(1)に従って可変することができる。 [0005]

※を広くすることが提案されているが、近年の移動体通信 のデジタル化に伴い、周波数の広帯域特性のより一層の 向上が求められ、電圧制御発振器においても、更に広帯 域かつ高安定の可変周波数を持つものが求められている のが現状である。

【0010】ところで、容量比ァの小さい共振子は、式 (2)、(3)に示す関係からも明らかなように、電気 機械結合係数k² の大きい圧電体材料を用いることで実 現できると考えられる。

[0011]

容量比r=C0 /C1

電気機械結合係数k゚=1/(1+r)……(3)

なお、従来、電圧制御発振器の共振子の圧電体材料につ いては、圧電体基板としてタンタル酸リチウム (LiT aO3) やニオブ酸リチウム (LiNbO3) 等を用い ることが提案されている(特開平2-104120号公 報、特開平2-12585号公報)。

[0012]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来、 電圧制御発振器の共振子の圧電体材料として提案されて いるLiTaO3 やLiNbO3 は、電気機械結合係数 k² は小さいが温度特性は良好であるか、或いは、電気 機械結合係数k² は大きいが温度特性が悪いというよう に、電気機械結合係数k2 と温度特性の少なくとも一方 が劣り、両特性を共に満足するものではない。

【0013】このため、電気機械結合係数k² が大きい 圧電体材料により容量比rの小さい共振子を実現して、 要求特性を満足する広帯域可変の電圧制御発振器を提供 することが困難であった。

【0014】本発明は上記従来の問題点を解決し、従来 10 の圧電体材料に比べて電気機械結合係数 k² が大きく、 かつQ値が大きく、しかも、温度特性の良好な圧電体材 料を用いた共振子を組み込むことで、VHF〜SHF帯 域に対応し、広帯域可変、高安定の電圧制御発振器を提 供することを目的とする。

[0015]

【課題を解決するための手段】本発明の電圧制御発振器 は、単結晶基板と、該単結晶基板上に形成された圧電体 薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電性膜とを備え る圧電共振子を用いた電圧制御発振器において、該圧電 20 分~1時間焼成する。 体薄膜がチタン酸ジルコン酸鉛(PZT)薄膜又はチタ ン酸鉛 (PT) 薄膜であることを特徴とする。

【0016】PZT及びPTは、電気機械結合係数k2 が大きく、かつQ値が大きく、しかも温度特性が良好で あるため、PZT薄膜又はPT薄膜を形成した圧電共振 子を用いることにより、VHF〜SHF帯域に対応し、 広帯域可変、高安定の電圧制御発振器を提供することが できる。

【0017】本発明において、圧電共振子としては次の ものが挙げられる。

【○○18】 ● 単結晶基板と、該単結晶基板上に形成 された圧電体薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電 性膜よりなる櫛形電極とを備える弾性表面波共振子。

- ② 単結晶基板と、該単結晶基板上に形成された圧電体 薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電性膜よりなる 櫛形電極とを備える1ポート型弾性表面波共振子。
- ③ 単結晶基板と、該単結晶基板上に形成された圧電体 薄膜と、該圧電体薄膜上に形成された導電性膜よりなる 櫛形電極とを備える2ポート型弾性表面波共振子。

[0019]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の電 圧制御発振器の実施の形態を説明する。

【0020】本発明の電圧制御発振器は、圧電共振子と して単結晶基板と、この単結晶基板上に形成されたPZ T薄膜又はPT薄膜の圧電体薄膜と、この圧電体薄膜上 に形成された導電性膜とを備える圧電共振子を用いるこ と以外は従来の圧電共振子を用いた電圧制御発振器と同 様の構成とすることができ、従って、その回路にはコル ピッツ型回路を用いて、図2又は図4に示すような構成 の電圧制御発振器とすることができる。

【0021】本発明に係る圧電共振子の単結晶基板とし ては、ダイヤモンド、サファイヤ、MgO、SrTiO3 等の単結晶を用いることが出来る。

【0022】単結晶基板上の圧電体薄膜としてのPZT またはPT薄膜は、必要に応じて、その厚さを $10\mu m$ 以下として成膜した薄膜を、櫛形電極間に電界をかけて 分極処理することにより形成したものである。

【0023】このような単結晶基板上に圧電体薄膜を形 成するには、ゾルゲル法を採用するのが好ましく、例え ば、次のような方法で形成することができる。

【0024】即ち、PZT薄膜の形成には、酢酸鉛等の 鉛化合物、ジルコニウムブトキシド、ジルコニウムプロ ポキシド等のジルコニウム化合物及びチタニウムイソプ ロポキシド、チタニウムブトキシド等のチタン化合物を 所定のモル比で、合計濃度が10~20重量%程度とな るように、メトキシエタノール、酢酸エステル等の溶剤 に溶解したPZT薄膜形成用組成物を基板に塗布し、1 50~400℃で乾燥し、所定の膜厚になるように、こ の塗布、乾燥を繰り返す。最後に500~800℃で1

【0025】また、PT薄膜の形成には、酢酸鉛等の鉛 化合物及びチタニウムイソプロポキシド、チタニウムブ トキシド等のチタン化合物の所定のモル比で、合計濃度 が10~20重量%程度になるように、メトキシエタノ ール、酢酸エステル等の溶剤に溶解したPT薄膜形成用 組成物を基板に塗布し、150~400℃で乾燥し、所 定の膜厚になるように、この塗布、乾燥を繰り返す、最 後に500~800℃で1分~1時間焼成する。

【0026】本発明において、圧電体薄膜としてのPZ 30 T薄膜又はPT薄膜は、高周波対応とするために膜厚1 Oμm以下であることが必要とされ、好ましくはO.1 $\sim 10 \, \mu$ m、より好ましくは0. $2 \sim 3 \, \mu$ mの範囲で使 用目的に応じて適宜決定される。なお、PZT薄膜又は PT薄膜の膜厚が薄過ぎると圧電効果が得られず、逆 に、厚過ぎると良好な膜質が得られない。

【0027】本発明においては、このPZT又はPT薄 膜の形成に先立ち、基板上にチタン酸バリウムストロン **チウム (BST)、チタン酸ストロンチウム (STO)** 又はチタン酸バリウム(BTO)等のバッファー層を形 成しても良い。このようなバッファー層を形成すること により、鉛拡散防止作用により、PZT薄膜又はPT薄 膜の鉛欠損が防止されるという効果が奏される。このバ ッファー層はゾルゲル法により形成することができ、そ の膜厚は通常の場合、0.01~2μm、特に0.01 \sim 0. 2μ mであることが好ましい。

【0028】圧電体薄膜上の導電性膜としては、A1, Cu, Ag, Au, Pt等の導電性金属膜が好適であ り、このような導電性膜はスパッタ法等で形成すること ができ、その厚さは、通常の場合1000~2000μ 50 m程度である。

[0029]

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明の電圧制御発振 器の構成及び効果をより具体的に説明する。

【0030】[実施例1]図2のコルピッツ回路に共振 子1として1ポート型弾性表面波共振子を組み込んで9 〇〇MHz帯の電圧制御発振器としたものを実施例1と した。図5(a)は本実施例で用いた1ポート型弾性表 面波共振子の電極構成を示す平面図、図5(b)は同断 面の拡大図である。この1ポート型弾性表面波共振子の 圧電基板50は、サファイヤ基板(厚さ500 μ m)5 10 μ m)71上に厚さ0.2 μ mのバッファー層(BST 1上に厚さ0. 2μ mのバッファー層(BST薄膜)5 2、厚さ0. 8μmのPZT薄膜53及び厚さ1500 ÅのA1電極54よりなり、A1電極(反射電極54 A,櫛形電極54B)54の間隙Wは2μm(弾性表面 波の波長入の1/2)である。

【0031】この電圧制御発振器において、制御電圧V 』を○~5∨まで可変した場合の発振周波数の変化を図 8に示す。

【0032】なお、本実施例では、圧電体薄膜としての ニウムイソプロポキシドとを所定のモル比で合計濃度2 0重量%となるように2-メトキシエタノールに溶解し たPZT薄膜形成用溶液を用い、スピンコートにより塗 布した後400℃で乾燥し、この塗布、乾燥を所定の膜 厚になるまで繰り返し、最後に650℃で60分焼成す ることにより形成した。

【0033】また、導電性膜はスパッタ法により形成し た。

【0034】 [実施例2] 図2のコルピッツ回路に共振 子1として1ポート型弾性表面波共振子を組み込んで9 00MHz帯の電圧制御発振器としたものを実施例2と した。図6(a)は本実施例で用いた1ポート型弾性表 面波共振子の電極構成を示す平面図、図6 (b) は同断 面の拡大図である。この1ポート型弾性表面波共振子の 圧電基板60は、サファイヤ基板(厚さ500μm)6 1上に厚さ0.2 μmのバッファー層 (BST薄膜) 6 2、厚さ0.85μmのPT薄膜63及び厚さ1500 ÅのA1電極64よりなり、A1電極(反射電極64 A, 櫛形電極64B) 64の間隙Wは2μm (弾性表面 波の波長入の1/2)である。

【0035】この電圧制御発振器において、制御電圧V r を 0 ~ 5 V まで可変した場合の発振周波数の変化を図 9に示す。

【0036】なお、本実施例では、PT薄膜は、酢酸鉛 とチタニウムイソプロポキシドを所定のモル比で合計濃 度10重量%となるように2-メトキシエタノールに溶 解したPT薄膜形成用溶液を用い、スピンコートにより 塗布した後400℃で乾燥し、この塗布、乾燥を所定の 膜厚になるまで繰り返し、最後に650℃で60分焼成 することにより形成した。

6 【0037】また、導電性膜はスパッタ法により形成し た。

【0038】 [実施例3] 図2のコルピッツ回路に共振 子1として2ポート型弾性表面波共振子を組み込んで9 00MHz帯の電圧制御発振器としたものを実施例3と した。図7(a)は本実施例で用いた2ポート型弾性表 面波共振子の電極構成を示す平面図、図7(b)は同断 面の拡大図である。この2ポート型弾性表面波共振子の 圧電基板70は、単結晶ダイヤモンド基板(厚さ300 薄膜)72、厚さ0.8μmのPZT薄膜73及び厚さ 1500ÅのA1電極74よりなり、A1電極 (反射電 極74A,櫛形電極74B)54の間隙Wは2μm(弾 性表面波の波長入の1/2)である。

【0039】この電圧制御発振器において、制御電圧V r を 0~5 Vまで可変した場合の発振周波数の変化を図 10に示す。

【0040】なお、本実施例では、圧電体薄膜としての PZT薄膜は、酢酸鉛とジルコニウムブトキシドとチタ PZT薄膜は、酢酸鉛とジルコニウムブトキシドとチタ 20 ニウムイソプロポキシドとを所定のモル比で合計濃度2 ①重量%となるように2-メトキシエタノールに溶解し たPZT薄膜形成用溶液を用い、スピンコートにより塗 布した後400℃で乾燥し、この塗布、乾燥を所定の膜 厚になるまで繰り返し、最後に650℃で60分焼成す ることにより形成した。

> 【0041】また、導電性膜はスパッタ法により形成し た。

【0042】また、実施例においては、いずれも圧電共 振子を図2に示すコルピッツ回路に組み込んで特性を調 30 べたが、比較のため、特開昭61-135205号公報 に記載される電圧制御発振器(A)及び同公報において 従来例として挙げた電圧制御発振器(B)について以下 の実施例と同様にして測定した発振周波数の変化を図1 1 に示した。

【0043】以上の結果から、本発明の電圧制御発振器 は、従来の圧電基板を用いたものに比べ、非常に広帯域 な、制御感度の高いものであることが明らかである。 [0044]

【発明の効果】本発明によると、単結晶基板上に構成さ 40 れたチタン酸ジルコン酸鉛 (PZT) 又はチタン酸鉛 (PT) 薄膜と、上記圧電薄膜上に構成された導電性膜 が構成された圧電共振子を用いた電圧制御発振器は、大 きな電気機械結合係数k、優れたQ特性を有するチタン 酸ジルコン酸鉛(PZT)又はチタン酸鉛(PT)を用 いるため、効果として、非常に広帯域の周波数をカバー するS/N比の優れた電圧制御発振器が提供出来る。 【図面の簡単な説明】

【図1】 圧電共振子の電気的等価回路図である。

【図2】 コルピッツ型電圧制御発振器の基本構成図で 50 ある。

【図3】 図2の電圧制御発振器の等価回路図である。

【図4】 広帯域可変にしたコルピッツ型電圧制御発振 器の構成図である。

【図5】 図5(a)は、実施例1で用いた1ポート型 弾性表面波共振子の電極構成を示す平面図、図5(b) は、同断面の拡大図である。

【図6】 図6(a)は、実施例2で用いた1ポート型 弾性表面波共振子の電極構成を示す平面図、図6(b) は、同断面の拡大図である。

【図7】 図7(a)は、実施例3で用いた2ポート型 10 52,62,72バッファー層 弾性表面波共振子の電極構成を示す平面図、図7(b) は、同断面の拡大図である。

【図8】 実施例1の電圧制御発振器の特性を示すグラ フである。

【図9】 実施例2の電圧制御発振器の特性を示すグラ フである。

8

【図10】 実施例3の電圧制御発振器の特性を示すグ ラフである。

【図11】 比較例に係る電圧制御発振器の特性を示す グラフである。

【符号の説明】

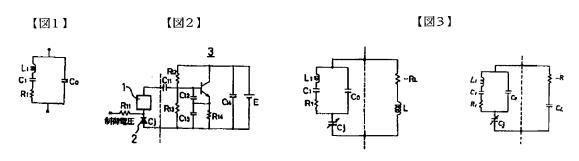
50,60,70圧電基板

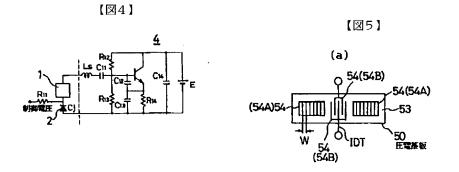
51,61,71 単結晶基板

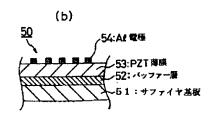
53,73 PZT薄膜

54,64,74 A1電極

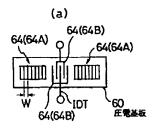
63 PT薄膜



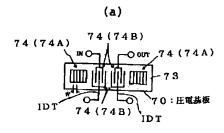


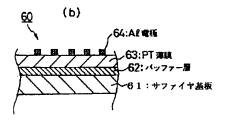


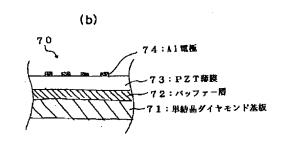


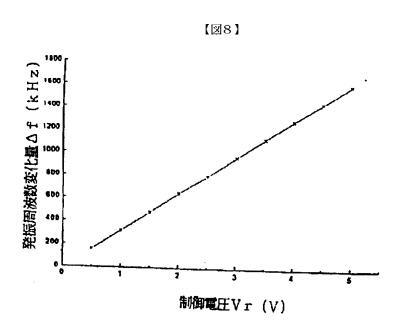


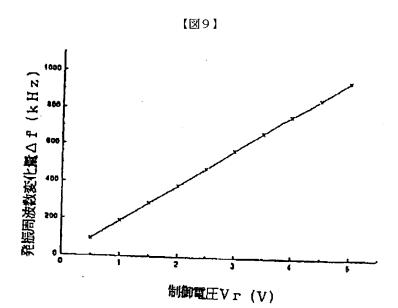
【図7】

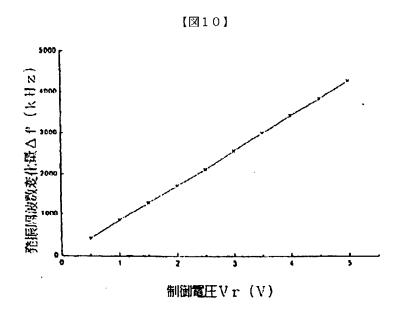




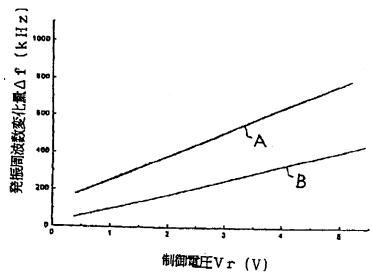












フロントページの続き

(72)発明者 疋田 和康 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 三 菱マテリアル株式会社内